

2022年12月1日

X線分析研究懇談会第278回例会

日時：2023年1月20日（金）15:30~17:30

場所：東広島芸術文化センターくらら 研修室1・2(208/209号室)

JR山陽線・西条駅から徒歩4分

<https://kurara-hall.jp/>

参加費：無料

プログラム

15:30-16:20

題目 X線マイクロCTを用いた微細試料の法科学的異同識別に関する基礎的検討

多田野 渉（広島大院工・社会人博士課程、広島県警科捜研）

休憩

16:30-17:30

題目 電子線トモグラフィー及びFIB-SEMによる三次元元素マップ

田辺 栄司（広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター 生産技術アカデミー）

広めの会場を予約しておりますが、コロナ感染症の状況により参加人数を制限させていただく場合もございます。1/16（月）頃までにお申込みいただくことをお勧めいたします。

問い合わせ先・お申し込み先

広島大学大学院先進理工系科学研究科

応用化学プログラム

早川 慎二郎

hayakawa@hiroshima-u.ac.jp